

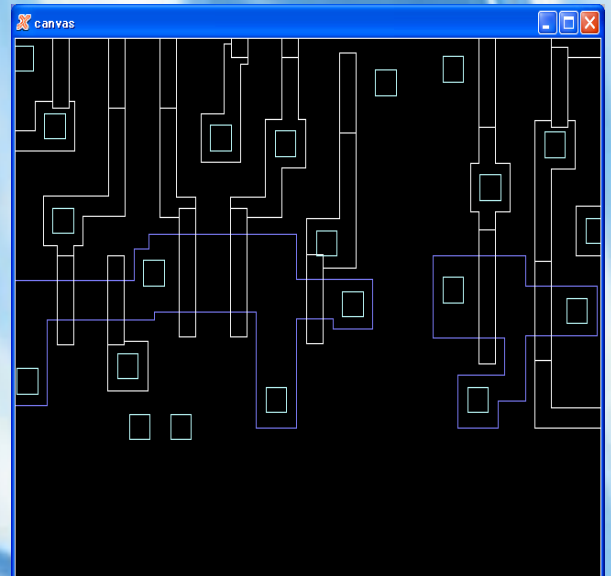
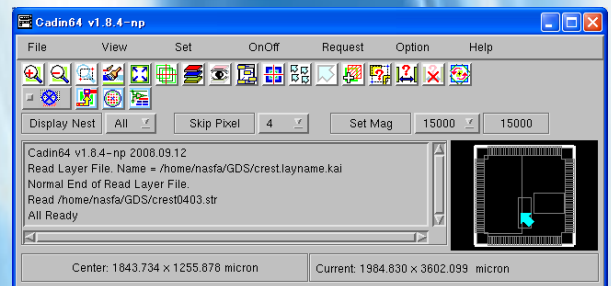
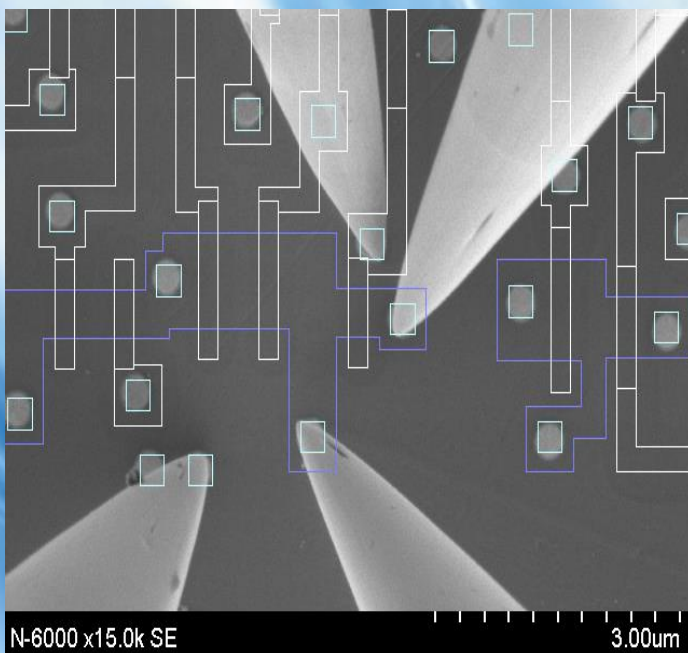
LSI 故障解析用観察・リペア装置と設計 CAD データとを密接にリンク！

高速 CAD ナビゲーションシステム

# NASFA

(Navigation System for  
Failure Analysis)

迅速かつ正確に欠陥箇所を特定できる  
“国産 CAD ナビゲーションシステム”が誕生致しました。

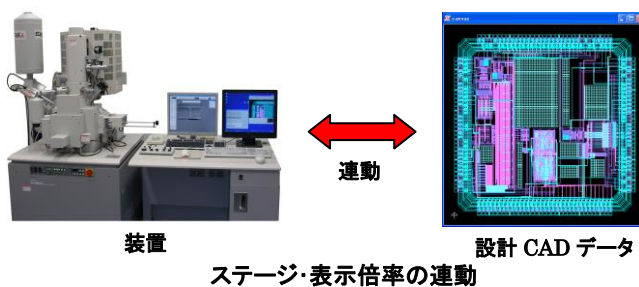


## 特長

- ◆ LSI 故障解析用観察・リペア装置と設計 CAD データとのステージ連動
- ◆ SEM/SIM 像と設計 CAD データとの重ね合わせ表示 (オーバーレイ表示)

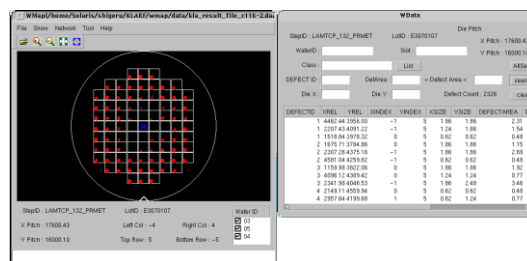
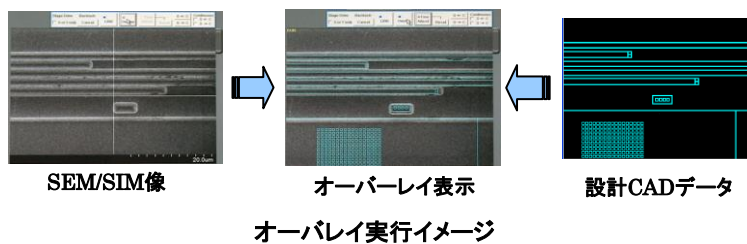
## 【NASFA の機能】

- ◆ 設計 CAD データとステージ・表示倍率の連動
- ◆ SEM/SIM 像と設計 CAD データのオーバーレイ
- ◆ データロケータ機能(故障候補座標の登録)
- ◆ 等電位ノード(配線)トレース機能
- ◆ フェイルビットマップ、ウェハマップ(KLA Result フォーマット対応)等、豊富なオプション機能を搭載



## 【NASFA の特長】

- ◆ 日立ハイテクノロジーズ社製解析装置専用 CAD ナビゲーションシステム
- ◆ GDS II ストリームデータのみで動作
- ◆ 大規模な設計 CAD データを高速表示
- ◆ SEM/SIM 画面とのリンクが強力
  - ・ アライメント作業が容易
  - ・ 下層配線部の加工が容易
  - ・ プローブ位置の確認が容易
- ◆ 装置間の故障候補位置の受渡しが可能



ウェハマップ(オプション)実行イメージ

## システム構成



日立ハイテクノロジーズ社製解析装置群 (SEM、FIB、Prober、FIB-SEM)

PC (WindowsXP)

WS (Soleris10 or RedHatEL)

Ethernet

## 搭載可能装置

- NB5000 (日立集束イオン/電子ビーム加工観察装置 nanoDUE™)
- N-6000、NE4000 (日立微小デバイス特性評価装置 ナノ・プローバ®、nanoEBAC®)
- FB-2100、FB2200 (日立集束イオンビーム加工観察装置)
- S-4700、S-4800 (日立高分解能電界放出形走査電子顕微鏡)

- ※ NB5000(nanoDUE™)、N-6000、NE4000(ナノ・プローバ®、nanoEBAC®)、FB-2100、FB2200、S-4700、S-4800 は日立ハイテクノロジーズ社の製品です。
- ※ 本カタログ記載の内容は、改良等の為、予告なしに変更される事があります。
- ※ 本カタログ中の会社名・製品名等は、各社の商標または登録商標です。

## 販売総代理店

開発元  
株式会社 アストロン

**ASTRON**  
advanced software technology

〒160-0023 西新宿 4-32-12 西新宿フォレスト ロビー階  
TEL:03-6304-2181

お問合せ先: sales@astron.co.jp